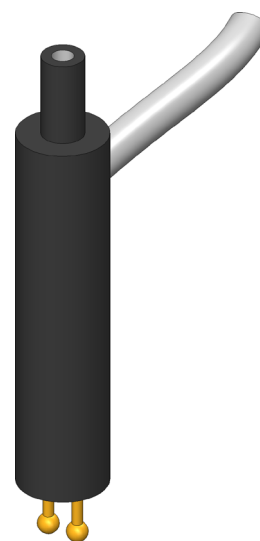




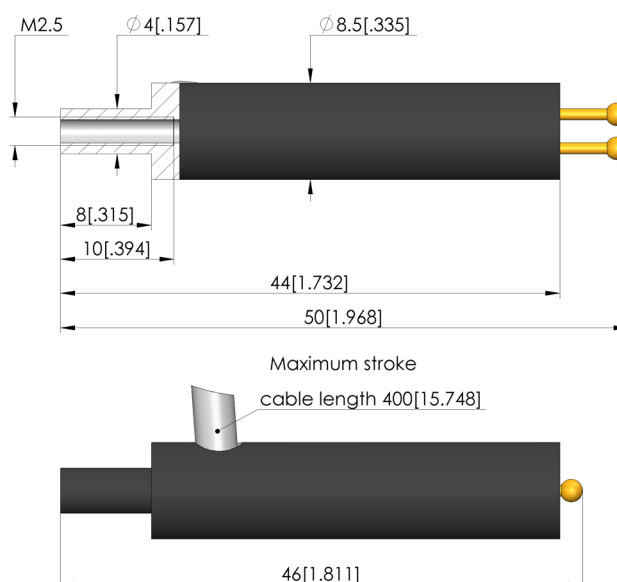
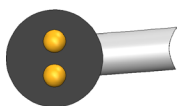
- Componentes para opens test, para prueba capacitiva de chips semiconductores por rupturas, cortocircuitos y errores de soldadura
- Adecuado para sistemas de prueba SPEA

Utilización

La sonda de prueba OpenPin se utiliza para pruebas capacitivas de circuitos integrados, para probar las conexiones unidas por cables al interior de un circuito integrado respecto a roturas, cortocircuitos y errores de soldadura.



1:1



Datos generales

Grupo de productos:
 Serie:
 Tipo:
 Modelo:
 Tipo de accesorios:
 Estado de entrega:
 Altura:
 Peso:
 Temperatura mín.:
 Temperatura máx.:
 Conforme RoHS:

Opens Test
 OTC
 SPEA opens test
 OpenPin Check
 Accesorios customizados
 Escan-Probe-30
 50 mm
 0,01 kg
 10 °C
 60 °C
 Sí

Compatible con

Juegos de recambio (WS):

WS SPEA

Datos técnicos

Carrera:
 Montaje:
 Cantidad de polos:
 Diámetro:
 Diámetro pivote:
 Longitud cable:

4 mm
 Rosca M2.5
 2
 8,5 mm
 4 mm
 400 mm

Escan ElectroScanProbe-30

OTC-SP-ES-EP-L400

Artículo 33513



DIRECTAMENTE AL PRODUCTO

ingun[®]

Partner for Future Technology



INGUN Prüfmittelbau GmbH

Max-Stromeyer-Straße 162
78467, Constance, Germany
Phone +49 7531 8105-0
Customer hotline +49 7531 8105-888
Fax +49 7531 8105-65
info@ingun.com



Precios y plazos de entrega a consultar.
Cambios técnicos reservados. 04/26_ES